

تشخیص عیب سنسوری با استفاده از رویتگرهای مدل‌گذشتۀ لغزشی در کلاسی از سیستم‌های غیرخطی لیپشیتز با عدم قطعیت

فریده الله وردی^۱، امین رمضانی^۲، مهدی فروزانفر^۳

^۱ دکتری تخصصی، گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. گروه مهندسی برق، واحد علوم و تحقیقات خوزستان،

دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران Allahverdi.f@gmail.com

^۲ استادیار گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس تهران ramezani@modares.ac.ir

^۳ استادیار، گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران Mehdi.forouzanfar@yahoo.com

پذیرش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

دریافت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

چکیده: در این مقاله روشی موثر برای تشخیص عیب سنسوری در کلاسی از سیستم‌های غیرخطی لیپشیتز در حضور نامعینی ارائه می‌شود. با تعریف ماتریس‌های انتقال حالت برای حالت‌ها و خروجی سیستم، سیستم اصلی به دو زیر سیستم تقسیم می‌شود. زیر سیستم اول شامل عدم قطعیت اما بدون عیب بوده و زیر سیستم دوم فقط شامل عیب سنسوری می‌باشد، بدون عدم قطعیت. عیب سنسوری در زیر سیستم دوم با روشی به صورت عیب عملگری مجازی ظاهر می‌شود. برای تشخیص عیب، رویتگرهای مدل‌گذشتۀ طراحی می‌شوند. با استفاده از تئوری لیاپانوف، پایداری دینامیک‌های خطای رویتگر اثبات می‌شود. پارامترها و ماتریس‌های لازم جهت طراحی رویتگر با حل مساله^۱ LMI به دست می‌آید. در نهایت با شبیه‌سازی امکان پذیری و کارائی مطلوب روش پیشنهادی نشان داده می‌شود.

کلمات کلیدی: تشخیص عیب، سیستم غیرخطی لیپشیتز، رویتگر مدل‌گذشتۀ لغزشی، عیب سنسوری، نامساوی ماتریسی خطی

Sensor Fault Detection for a class of Uncertain Nonlinear Systems Using Sliding Mode Observers

F. Allahverdi, A. Ramezani, M. Forouzanfar

Abstract: This paper deals with the issues of sensor fault detection for a class of Lipschitz uncertain nonlinear system. By definition coordinate transformation matrix for system states and output system, at first the original system divided into two subsystems. The first subsystem includes uncertainties but without any sensor faults and the second subsystem has sensor faults but is free of uncertainties. Then sensor faults in second subsystem are formed as actuator faults. For the aim of fault detection (FD) two sliding mode observers are designed for two subsystems. Stability condition is obtained based on Lyapunov approach. The necessary matrices and parameters to design observers are obtained by solving linear matrix inequality (LMI) problem. Finally, simulation example is given to illustrate the effectiveness proposed approach.

Keywords: fault detection, Lipschitz, nonlinear system, sliding mode observer, LMI

^۱ Linear matrix inequality

نیاز جهت طراحی رویتگرها بدست می‌آید. در نهایت اگر خطای تخمین خروجی بیشتر از مقدار آستانه تعیین شده باشد وقوع عیب سنسوری تشخیص داده می‌شود.

در ادامه مقاله مدل سیستم و معروفی ساختار عیب یابی در قسمت ۲ ارائه می‌شود. طراحی رویتگر جهت تشخیص عیب سنسور در قسمت ۳ و بررسی شرایط پایداری دینامیک های خطای رویتگر بر اساس ثوری لیاپانوف و تبدیل به مساله LMI در قسمت ۴ ارائه می‌شوند. نتایج شبیه سازی در قسمت ۵ ارائه می‌شود و در قسمت ۶ به صورت خلاصه نتیجه گیری یافته می‌شود.

۲- معرفی سیستم ساختار عیب یابی

کلاسی از سیستم‌های غیرخطی چند ورودی چند خروجی بصورت در نظر گرفته می‌شود.

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + g(x)U(t) + M\eta(x) \\ y(t) &= Cx(t) + Ff_s \end{aligned} \quad (1)$$

که $x \in R^n$ حالت سیستم، $U \in R^m$ ورودی، $y \in R^p$ خروجی سیستم، $f_s \in R^q$ عیب سنسور و $\eta \in R^r$ نامعینی سیستم است. $(g(x))$ تابع غیرخطی لپیشیتر می‌باشد که می‌توان آن را بصورت ترکیب دو تابع خطی و غیرخطی زیر نوشت.

$$g(x) = g_l(x) + g_{nl}(x) \quad (2)$$

$$\text{که: } B = g_l(x)$$

بنابراین می‌توان رابطه (۱) را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + BU(t) + g_{nl}(x)U(t) + M\eta(x) \\ y(t) &= Cx(t) + Ff_s \end{aligned} \quad (3)$$

ماتریس‌های F_s دارای ابعاد مناسب می‌باشند.

$A \in R^{n \times n}$, $B \in R^{n \times m}$, $C \in R^{p \times n}$, $M \in R^{n \times r}$, $F \in R^{p \times q}$, $p \geq q + r$

و ماتریس‌های F, M, C رتبه کامل دارند.

$$\text{فرض ۱) } \text{rank}(CM) = \text{rank}(M)$$

فرض ۲) برای هر مقدار s با قسمت حقیقی غیرمنفی :

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & M \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + \text{rank}(M) \quad (4)$$

فرض ۳) جمله غیرخطی شرط لپیشیتر را برقرار می‌سازد.

$$\forall x, \hat{x} \in R^n \|g(x, t) - g(\hat{x}, t)\| \leq kg \quad (5)$$

که kg ثابت لپیشیتر می‌باشد.

فرض ۴) عیب سنسوری و نامعینی در محدود زیر می‌باشند:

$$\|\eta_s\| \leq \eta_0 \|f_s\| \leq \rho_s \quad (6)$$

مقادیر η_0 , ρ_s , ثابت‌های مثبت و معلومی هستند.

در این پژوهش، هدف یافتن عیب سنسوری می‌باشد و ساختار پیشنهادی در شکل ۱ آمده است.

۱- مقدمه

با پیشرفت سیستم‌های صنعتی، پیچیدگی سیستم‌های کنترل نیز افزایش می‌یابد و نیاز به دقت و سرعت بالا بیشتر احساس می‌شود. سنسورها معمولاً اطلاعات مهمی را برای سیستم‌های کنترل فیدبک حمل می‌کنند. خروجی سنسور معیوب ممکن است باعث اشتباهاتی در تصمیم گیری کنترلی سیستم شود و لذا وقوع عیب سنسوری باعث کاهش کارایی و یا حتی منجر به ناپایداری سیستم می‌شود. در سال‌های اخیر تشخیص به موقع عیب در سیستم‌ها جهت افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌ها مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است [۴-۱]. با در دسترس بودن مدل ریاضی سیستم، استفاده از رویتگرها جهت تشخیص عیب در میان روش‌های مختلف تشخیص و ایزوله عیب مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش‌هایی از رویتگرها و رودی ناشناخته (UIO) برای تفکیک عیب استفاده شده است [۵-۸]. رویتگرها مدل غزشی (SMO) برای تشخیص و ایزوله عیب مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند [۹-۱۷]. پژوهش‌های بسیاری در زمینه تشخیص عیب‌های عملگری انجام شده است [۱۸-۲۱] اما در زمینه تشخیص عیب‌های سنسوری در مقایسه با عیب‌های عملگری نتایج کمتری در دسترس می‌باشد. برای مثال یک روش تخمین تطبیقی برای تشخیص عیب سنسور برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی لپیشیتر در [۲۲] ارائه شده است. در [۲۳] به کمک سیستم‌های فازی T-S یک آستانه مرزی تطبیقی برای کاهش اثر تاخیر زمانی هنگام وقوع عیب سنسوری و تطبیق عیب [۲۴] ارائه شده است. در [۲۴] تخمین عیب سنسور و جبران سازی برای سیستم تاخیر زمانی با روش رویتگر توصیفی ارائه شده است. در [۲۵] به تخمین عیب عملگری به کمک رویتگر مد لغزشی پرداخته شده است. در [۲۶] به بررسی تشخیص عیب سنسوری و عملگری در سیستم خطی پرداخته می‌شود، در ابتدا تشخیص عیب عملگری برای یک سیستم خطی به کمک رویتگر مد لغزشی بررسی شده و سپس بازسازی عیب سنسوری برای سیستم با معادلات دینامیکی خطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در زمینه عیب‌های سنسوری چندگانه نیز پژوهش‌های محدودی انجام شده است [۲۷-۲۸].

در این مقاله به تشخیص عیب سنسوری برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی لپیشیتر با عدم قطعیت با استفاده از رویتگر مد لغزشی پرداخته می‌شود. ابتدا تابع غیرخطی به دو قسمت خطی و غیرخطی تفکیک می‌شود. با تعریف ماتریس‌های انتقال حالت و خروجی، سیستم اصلی به دو زیر سیستم تقسیم می‌شود. زیر سیستم اول شامل عدم قطعیت اما بدون عیب سنسوری بوده و زیر سیستم دوم فقط شامل عیب سنسوری می‌باشد، در حالیکه هیچ اثری از عدم قطعیت در آن وجود ندارد. سپس با تکنیکی عیب سنسوری به صورت عیب مجازی عملگری ظاهر می‌شود. برای رسیدن به هدف تشخیص عیب دو رویتگر مد لغزشی برای زیرسیستم‌ها طراحی می‌شود. پایداری رویتگرها طراحی شده با استفاده از ثوری لیاپانوف اثبات می‌شود. با حل مساله LMI پارامترها و ماتریس‌های مورد

^۱ Fault accommodation

که در این روابط $g_1(T^{-1}Z, t) = T_1 g(T^{-1}Z, t)$ و $g_2(T^{-1}Z, t) = T_2 g(T^{-1}Z, t)$ می باشد.

لم ۲: با توجه به فرض ۲ $\text{rank} \begin{bmatrix} SI - A \\ C \end{bmatrix} = n$ زوج (A_4, C_4) رویت پذیر است.

بردار حالت جدید Z_3 به گونه ای تعریف می شود که:

$$\dot{Z}_3 = C_4 Z_2 + F_2 f_s \quad \text{و} \quad Z_3 = \int_0^t W_2(T) d\tau$$

از ترکیب روابط فوق رابطه ۱۰ بدست می آید.

$$\begin{bmatrix} \dot{Z}_2 \\ \dot{Z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_4 & 0 \\ C_4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_2 \\ Z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_3 \\ 0 \end{bmatrix} Z_1 + \begin{bmatrix} g_2(T^{-1}Z, t) \\ 0 \end{bmatrix} U + \begin{bmatrix} 0 \\ F_2 \end{bmatrix} f_s \quad (10)$$

$$W_3 = Z_3$$

رابطه ۱۰ را بصورت رابطه ۱۱ می توان بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} \dot{Z}_0 &= A_0 Z_0 + A_{01} Z_1 + g(Z_0) U + F_0 f_s \quad (11) \\ W_3 &= C_0 Z_0 \end{aligned}$$

که در آن $Z_0 = \begin{bmatrix} Z_2 \\ Z_3 \end{bmatrix} \in R^{n+p-2r}$

$\bar{A}_3 = \begin{bmatrix} A_3 \\ 0 \end{bmatrix} \in R^{(n+p-2r) \times r}$ ، $\begin{bmatrix} A_4 & 0 \\ C_4 & 0 \end{bmatrix} \in R^{(n+p-2r) \times (n+p-2r)}$

، $B_0 = \begin{bmatrix} B_2 \\ 0 \end{bmatrix} \in R^{(n+p-2r) \times m}$ ، $F_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2 \end{bmatrix} \in R^{(n+p-2r) \times q}$ ،

$g_2(T^{-1}Z, t) =$ ، $C_0 = [0 \quad I_{p-r}] \in R^{(p-r) \times (n+p-2r)}$

می باشد. همچنین می توان رابطه ۸ را بصورت رابطه ۱۲ بازنویسی کرد.

$$\begin{aligned} \dot{Z}_1 &= A_1 Z_1 + \bar{A}_2 Z_0 + g_1(T^{-1}Z, t) U + B_1 U \\ &\quad + M_1 \eta \quad (12) \end{aligned}$$

$$W_1 = C_1 Z_1$$

که $\bar{A}_2 = [A_2 \quad 0_{r \times (p-r)}]$

لم ۳) اگر فرض ۲ برقرار باشد زوج (A_0, C_0) رویت پذیر است.

اثبات: طبق آزمون PBH زوج رویت پذیر است اگر و فقط اگر:

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} SI - A_0 \\ C_0 \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} SI - A_4 & 0 \\ -C_4 & SI \end{bmatrix} \quad (13) \\ &= n + p - 2r \end{aligned}$$

اگر $s=0$ رابطه زیر برقرار است :

$$\text{rank} \begin{bmatrix} SI - A_4 & 0 \\ -C_4 & SI \\ 0 & I \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} -A_4 \\ -C_4 \end{bmatrix} + p - r$$

اگر فرض ۲ برقرار باشد زوج (A_4, C_4) رویت پذیر است و بنابراین برای

تمام مقادیر S داریم :

$$\text{rank} \begin{bmatrix} SI - A_4 \\ C_4 \end{bmatrix} = n - r$$

بنابراین اگر $s=0$ باشد رنک رابطه (۱۳) از لم ۳ برقرار است.

اگر $s \neq 0$ با توجه به رویت پذیری (A_4, C_4) می توان نوشت:

$$\begin{bmatrix} SI - A_4 & 0 \\ -C_4 & SI \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = 0$$

یعنی ستون های ماتریس $\begin{bmatrix} SI - A_4 & 0 \\ -C_4 & SI \\ 0 & I \end{bmatrix}$ مستقل خطی هستند و رتبه $n+p-2r$ می باشد و اثبات کامل است.



شکل ۱: ساختار تشخیص عیب سنسوری به روش پیشنهادی

لم ۱) با توجه به فرض ۱ ، ماتریس های انتقال حالت و خروجی بصورت زیر وجود دارد.

$$W = Sy = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} Z = Tx = \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{bmatrix}$$

به همین ترتیب در سیستم جدید می توان نوشت:

$$TAT^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}, TB = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, TM = \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

$$SCT^{-1} = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_4 \end{bmatrix}, SF = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2 \end{bmatrix}$$

، $T_1 \in R^{r \times n}$ ، $S = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} \in R^{p \times p}$ ، $T = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} \in R^{n \times n}$ ، $A_1 \in R^{r \times r}$ ، $W_1 \in R^r$ ، $Z_1 \in R^r$ ، $S_1 \in R^{r \times p}$ ، $C_1 \in R^{r \times r}$ ، $M_1 \in R^{r \times r}$ ، $B_1 \in R^{r \times m}$ ، $A_4 \in R^{(n-r) \times (n-r)}$ ، $C_1, F_2 \in R^{(p-r) \times (n-r)}$ ، $C_4 \in R^{(p-r) \times (n-r)}$ معکوس پذیر است.

۳- طراحی رویتگر مدلغزشی چهت تشخیص عیب

جهت عیب یابی سیستم ۱ با استفاده از رویتگر مدلغزشی ابتدا عیب سنسور با تکنیکی به عیب عملگر تبدیل می شود و سپس برای سیستم جدید رویتگر طراحی می شود.

در ادامه سیستم به دو زیرسیستم تقسیم می شود، زیرسیستم اول شامل عدم قطعیت اما بدون عیب و زیرسیستم دوم شامل عیب ولی بدون عدم قطعیت است. روابط زیر سیستم های اول و دوم به ترتیب در روابط ۸ و ۹ نشان داده شده اند.

$$\dot{Z}_1 = A_1 Z_1 + A_2 Z_2 + g_1(T^{-1}Z, t) U + B_1 U + M_1 \eta \quad (8)$$

$$W_1 = C_1 Z_1$$

$$\dot{Z}_2 = A_3 Z_1 + A_4 Z_2 + B_2 U + g_2(T^{-1}Z, t) U \quad (9)$$

$$W_2 = C_4 Z_2 + F_2 f_s$$

قضیه ۱: وقتی سیستم عیب سنسوری ندارد دینامیک های خطای روابط
۱۹ $P_1 = , L_0 > 0 , A_{1s} < 0 , P_0 = P_0^T > 0 , P_1^T > 0$ و اسکالارهای α_1, α_0 به نحوی وجود داشته باشند که:

$$\Lambda := \begin{bmatrix} \Pi_1 + \frac{1}{\alpha_1} P_1 P_1 & P_1 \bar{A}_2 \\ \bar{A}_2^T P_1 & \Pi_2 + \frac{1}{\alpha_0} P_0 P_0 + \alpha I_{n+p-2r} \end{bmatrix} < \alpha \quad (21)$$

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= A_{1s}^T P_1 + P_1 A_{1s} \\ \Pi_2 &= (A_0 - L_0 C_0)^T P_0 + P_0 (A_0 - L_0 C_0) \\ \alpha &= \alpha_1 k_g^2 \|T^{-1}\|^2 + \alpha_0 k_g^2 \|T^{-1}\|^2 \end{aligned}$$

اثبات: تابع لیپانوف به صورت زیر انتخاب می شود:

$$V(e_1, e_0) = V_1(e_1) + V_0(e_0)$$

$$\begin{aligned} V_0(e_0) &= e_0^T P_0 e_0 \\ &\text{مشتق زمانی } V_1 \text{ و } V_0 \text{ بصورت زیر بدست می آید.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1(e_1) &= e_1^T (P_1 A_{1s} + A_{1s}^T P_1) e_1 + 2e_1^T P_1 \bar{A}_2 e_0 \\ &\quad + 2e_1^T P_1 M_1 \eta + 2e_1^T P_1 D_1 d \\ &+ 2e_1^T P_1 (g_1(T^{-1}Z, t) - g_1(T^{-1}\hat{Z}, t)) U - 2e_1^T P_1 v_1 \\ &\text{برای } \alpha > 0 \text{ به ازای هر مقدار } 2X^T Y \leq \frac{1}{\alpha} X^T X + \alpha Y^T Y \text{ برقرار است.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1(e_1) &\leq e_1^T (P_1 A_{1s} + A_{1s}^T P_1) e_1 + 2e_1^T P_1 \bar{A}_2 e_0 \\ &+ 2e_1^T P_1 M_1 \eta + 2e_1^T P_1 D_1 d + \frac{1}{\alpha} e_1^T P_1 P_1^T e_1 \\ &+ \alpha (g_1(T^{-1}Z, t) - g_1(T^{-1}\hat{Z}, t))^T (g_1(T^{-1}Z, t) \\ &\quad - g_1(T^{-1}\hat{Z}, t)) - 2e_1^T P_1 v_1 \\ &\text{بنابراین قبل از وقوع عیب:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_1 - \hat{Z}_1 &= \begin{bmatrix} 0 \\ e_2 \end{bmatrix} \\ \|T^{-1}Z - T^{-1}\hat{Z}\| &= \|T^{-1}e_2\| \leq \|T^{-1}e_0\| \\ \|g_1(T^{-1}Z, t) - g_1(T^{-1}\hat{Z}, t)\| &\leq k_{g1} \|T^{-1}\| \|e_0\| \\ \|g_1(T^{-1}Z, t) - g_1(T^{-1}\hat{Z}, t)\| &\leq k_{g1} \|T^{-1}\| \|e_0\| \\ k_{g1} &= \|T_1\| k_g, \quad k_{g2} = \|T_2\| k_g \\ e_1^T P_1 v_1 &= k_1 \|P_1 e_1\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1(e_1) &\leq e_1^T \Pi_1 e_1 + 2e_1^T P_1 \bar{A}_2 e_0 + \frac{1}{\alpha_1} e_1^T P_1 P_1 e_1 \\ &\quad + \alpha_1 k_{g1}^2 \|T^{-1}\|^2 \|e_0\|^2 \end{aligned}$$

و همچنین:

$$\begin{aligned} \dot{V}_0(e_0) &\leq e_0^T \Pi_2 e_0 + 2e_0^T P_1 \bar{A}_2 e_0 + \frac{1}{\alpha_0} e_0^T P_0 P_0 e_0 \\ &\quad + \alpha_0 k_{g2}^2 \|T^{-1}\|^2 \|e_0\|^2 \\ \dot{V} &= \dot{V}_1(e_1) + \dot{V}_0(e_0) \leq \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}^T \Lambda \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} \\ \text{ماتریس های } P_0 = P_0^T &> 0 , P_1 = P_1^T > 0 , L_0 > 0 , A_{1s} < 0 \\ \text{و اسکالارهای } \alpha_1, \alpha_0 &\text{ به نحوی وجود دارند که نامساوی رابطه ۲۱ برقرار شود. و برای } e \neq 0 \text{ مقدار } < \hat{V} \text{ می باشد.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{برای هر } 0 &\neq e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} \text{ پایداری دینامیک های خطای تضمین می شود.} \\ \text{ماتریس هایی که نامساوی ۲۱ را برقرار می سازند با حل مساله LMI زیر بدست می آیند. ماتریس های } P_1 = P_1^T &> 0 , P_0 = P_0^T > 0 \text{ و } X, y_0 \text{ و اسکالارهای مثبت } \alpha_1, \alpha_0 \text{ به نحوی وجود دارند که:} \end{aligned}$$

با توجه به لم ۳ ماتریس $L_0 \in R^{(n+p-2r) \times (p-r)}$ بنحوی وجود دارد $A_0 - L_0 C_0$ پایدار است و برای $Q_0 > 0$ رابطه لیپانوف زیر پاسخ یکتای $0 > P_0$ را دارد.

$$(A_0 - L_0 C_0)^T P_0 + P_0 (A_0 - L_0 C_0) = -Q_0 \quad (14)$$

فرض ۱ وجود ماتریس های T و S را تضمین می کند، بطوریکه عیب های سنسوری و نامعینی ها کاملا از هم جدا شوند. بعد از انتقال، زیر سیستم اول فقط شامل نامعینی است و زیر سیستم دوم فقط شامل عیب و بدون در نظر گرفتن نامعینی است. برای زیر سیستم رابطه ۶ رویتگر مدل غزشی بصورت زیر طراحی می شود.

$$\dot{\hat{Z}}_1 = A_1 \hat{Z}_1 + \bar{A}_2 \hat{Z}_0 + g_1(T^{-1} \hat{Z}, t) U + B_1 U \quad (15)$$

$$\begin{aligned} &+ (A_1 - A_{1s}) C_1^{-1} (w_1 - \hat{w}_1) + v_1 \\ \hat{W}_1 &= C_1 \hat{Z}_1 \end{aligned}$$

که $A_{1s} \in R^{r \times r}$ ماتریسی پایدار است که باید تعیین شود. \hat{Z} به نحوی تعریف می شود که: $\hat{Z} := \text{col}(c_1^{-1} w_1, \hat{Z}_2)$ و v_1 به صورت رابطه ۱۶ می باشد.

$$\begin{aligned} \bar{v}_1 &= \begin{cases} k_1 \frac{P_1 (Z_1 - \hat{Z}_1)}{\|P_1 (Z_1 - \hat{Z}_1)\|} & \text{if } Z_1 - \hat{Z}_1 \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ k_1 &= \|M_1\| \eta_0 + \gamma \end{aligned} \quad (16)$$

۷ اسکالار مثبت است که باید تعیین شود. $P_1 \in R^{r \times r}$ ماتریس مثبت معین مترانگ است.

برای سیستم رابطه ۱۱ رویتگر زیر طراحی می شود:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{Z}}_0 &= A_0 \hat{Z}_0 + \bar{A}_3 C_1^{-1} w_1 + \bar{g}_2(T^{-1} \hat{Z}, t) U + \\ &B_0 U + L_0 (w_3 - \hat{w}_3) + v_2 \\ \hat{W}_3 &= C_0 \hat{Z}_0 \end{aligned} \quad (17)$$

v_2 به صورت رابطه ۱۸ می باشد.

$$\begin{aligned} v_2 &= \begin{cases} k_1 \frac{E_0 (Z_3 - \hat{Z}_3)}{\|E_0 (Z_3 - \hat{Z}_3)\|} & \text{if } Z_3 - \hat{Z}_3 \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned} \quad (18)$$

که L_0 بهره ای است که تعیین می شود.

۴- بررسی پایداری دینامیک های خطای رویتگرها

اگر خطای تخمین حالت به صورت $e_1 = e_0 = Z_0 - \hat{Z}_0$ و $Z_1 - \hat{Z}_1$ تعریف شود و دینامیک های خطای قبل از وقوع عیب بصورت زیر بدست آیند، می توان نوشت:

$$\begin{aligned} e_1(t) &= A_{1s} e_1 + \bar{A}_2 e_0 + g_1(T^{-1}Z, t) U \\ &- g_1(T^{-1}\hat{Z}, t) U + M_1 \eta \\ &- v_1 \end{aligned} \quad (19)$$

$$e_0(t) = (A_0 - L_0 C_0) e_0 + \bar{g}_2(T^{-1}Z, t) U - \bar{g}_2(T^{-1}\hat{Z}, t) U - v_2 \quad (20)$$

تئوری زیر شرایط کافی برای وجود رویتگرها روابط ۱۵ و ۱۷ را ارائه می دهد.

پس از اعمال ماتریس‌های تبدیل، ماتریس‌های جدید سیستم به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$A = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 1.25 \\ -2.5 & -1.5 & 1.25 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}, TB = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = SCT^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, TM = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, SF = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

با حل مساله LMI پارامترهای زیر بدست می‌آیند:

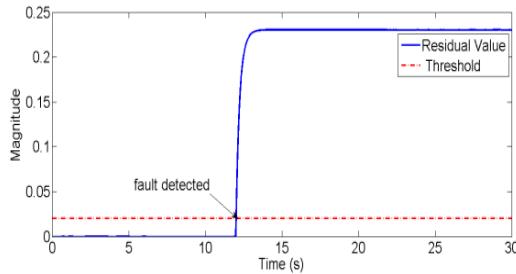
$$P_1 = 0.4378, A_{1s} = -0.8859, \alpha_0 = 1.4104, L_{02} = 1.0713$$

$$E_0 = \begin{bmatrix} 0.2833 \\ 0 \end{bmatrix}, L_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.0713 \end{bmatrix}$$

برای تشخیص عیب نرم خطای eW_3 انتخاب می‌شود. بعنوان مانده

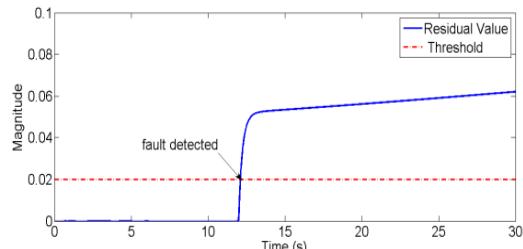
می‌باشد. حد آستانه در شیوه سازی ۰.۰۲ انتخاب شده است.

نتیجه تشخیص وقوع عیب $f_s = 0.5$ در لحظه $t=12$ به ازای شرایط اولیه صفر در شکل های ۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است عمل تشخیص عیب به خوبی و با سرعت بالا انجام می‌شود.

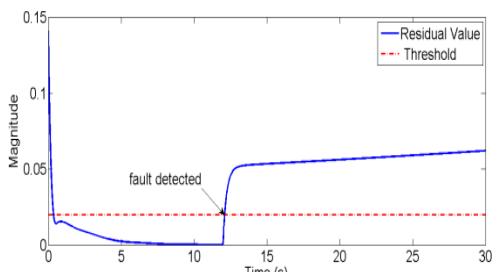


شکل ۱) تشخیص وقوع عیب سنسوری در لحظه ۱۲.

با تغییر عیب بصورت عیب نمایی $f_s = 0.1e^{0.01t}$ نتیجه تشخیص عیب در حالت شرایط اولیه صفر در زمان $t=12$ نشان داده شده است.



شکل ۲) اثر تغییر شرایط اولیه صفر به غیرصفر، در تشخیص عیب در این روش نشان داده شده است.



شکل ۳) تشخیص وقوع عیب سنسوری در لحظه ۱۲ برای شرایط اولیه غیرصفر

$$\begin{bmatrix} X + X^T & P_1 & P_1 \bar{A}_2 & 0 & 22 \\ P_1 & -\alpha_1 I & 0 & 0 & \\ \bar{A}_2^T P_1 & 0 & \bar{A}_0^T P_0 + P_0 A_0 - C_0^T y_0^T - y_0 C_0 + \alpha I & P_0 & \\ 0 & 0 & P_0 & -\alpha_0 I & \end{bmatrix} < 0$$

$$, y_0 = P_0 L_0 X = P_0 A_{1s}$$

بعد از وقوع عیب سنسوری در زمان t_f دینامیک‌های خطای تخمین حالت را می‌توان به صورت روابط زیر نوشت:

$$\begin{aligned} \dot{e}_1(t) = & A_{1s} e_1 + \bar{A}_2 e_0 + g_1(T^{-1} Z, t) U \\ & - g_1(T^{-1} \hat{Z}, t) U + M_1 \eta \\ & - v_1 \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \dot{e}_0(t) = & (A_0 - L_0 C_0) e_0 + \bar{g}_2(T^{-1} Z, t) U \\ & - \bar{g}_2(T^{-1} \hat{Z}, t) U + F_0 f_s \\ & - v_2 \end{aligned} \quad (24)$$

با مشاهده روابط فوق می‌توان دریافت e_0 فقط متاثر از عیب‌های سنسوری f_s می‌باشد اما در معرض نامعینی یا جمله v_1 نمی‌باشد.

ماتریس توزیع عیب سنسور $F_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2 \end{bmatrix}$ می‌باشد. بنابراین عیب سنسوری f_s روی آخرین $p-r$ جزء e_0 که $e_{rz3} = Z_3$ می‌باشد تاثیر دارد.

\hat{Z}_3 به طور خاص اگر عیب رخ دهد e_{rz3} تغییر می‌کند.

بر اساس این تحلیل برای مانده‌ای که وقوع عیب را تشخیص می‌دهد، می‌توان نوشت:

$$\|eW_3\| = \|C_0 e_0\| = \|ez_3\|$$

اگر $\|eW_3\| > \eta_0$ باشد بیانگر وجود عیب سنسوری است. η_0 حد آستانه تعیین شده می‌باشد.

زمان تشخیص t_d که $t_d \geq t_f$ بعنوان اولین لحظه که $\|eW_3\|$ بزرگتر از η_0 است، تعریف می‌شود.

۵- نتایج شیوه‌سازی

کارایی روش ارائه شده در تشخیص عیب سنسوری با یک مثال نشان داده می‌شود. مدل سیستم به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} U + \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin x_1 \\ 0 \end{bmatrix} U + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \eta$$

$$\eta = 0.5 * \sin t$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} f_s$$

$$g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin x_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

که در آن $g(x)$ جمله غیرخطی سیستم و η نامعینی می‌باشد.

ماتریس‌های انتقال $W = SyZ = T\chi$ ، به صورت زیر در نظر گرفته می‌شوند:

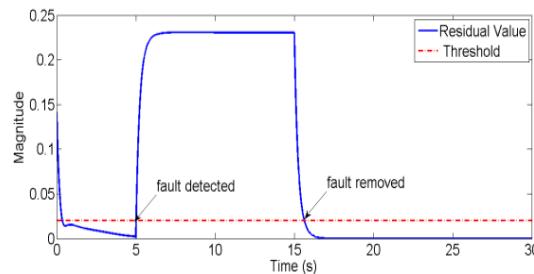
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

های مورد نیاز رویتگرهای طراحی شده با حل مساله LMI بدست آمد. کارائی روش ارائه شده با یک مثال شیوه سازی شده نشان داده شد. نتیجه شیوه سازی نشان داد که روش با دقت و سرعت بسیار خوبی وقوع عیب را تشخیص می دهد.

مراجع

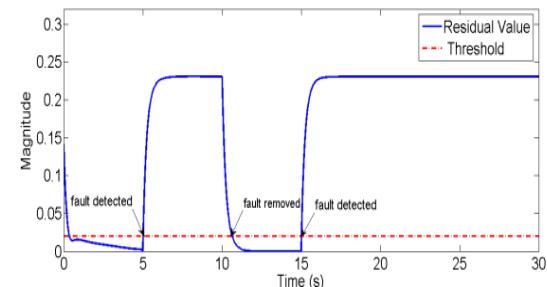
- [1] Liu X.Y, Song Y.D, Song Q. 2011, “Fault tolerant control of dynamic systems with unknown control direction input nonlinearities actuator failures”. Proceedings of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control conference (CDC-ECC) pp. 4973-4978 ,.
- [2] X.J. Li, G.H. Yang, 2012, “Robust adaptive fault-tolerant control for uncertain linear systems with actuator failures”, IET Control Theory & Applications. Vol.6, no.10, pp. 1544-1551.
- [3] Khebbache H, Tadjjine M, Labiod S, Boulkroune A. 2015, “Adaptive sensor fault tolerant control for a class of multivariable uncertain nonlinear systems” ISA Transaction, vol. 55, pp.100-115.
- [4] Chen C.C, Xu S.D, Liang Y.W. 2016, “Study of nonlinear integral sliding mode fault-tolerant control”, IEEE/ASME Transaction On mechatronic, vol. 21, no. 2, pp. 1160-1168.
- [5] Chen J, Patton RJ, Zhang HZ. 1996, “Design of unknown input observers and robust fault detection filters”, International journal of control, vol.63, pp. 85-105.
- [6] Zarei J, shokri E. 2014, “Robust sensor fault detection based on nonlinear unknown input observer”, Measurment, vol.48, pp. 355-367.
- [7] Liu X, Gao Zh. 2015, “Unknown input observers for fault diagnosis in Lipschitz nonlinear systems”, International conference on mechatronics and automation, August 2-5, pp. 1555-1560.
- [8] Liu X, Gao X, Han J. 2016, “Robust unknown input observer based fault detection for high order multi agent systems with disturbances”, ISA Transactions, vol. 61, pp. 15-28.
- [9] Ng K.Y, Tan C.P, Edwards C, Kuang Y.C, 2007, “New results in robust actuator fault reconstruction for linear uncertain systems using sliding mode observers”. International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol.17, pp.1294-1319.
- [10] Chen W and Saif M, 2008, “Actuator fault diagnosis for uncertain linear systems using a high-order sliding mode robust differentiator (HOSMRD)”, International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 18, no. 4-5, pp. 413-426.
- [11] Raoufi R, Marquez H.J, and Zinober A.S.I, 2010, “ H_∞ sliding mode observers for uncertain nonlinear Lipschitz systems with fault estimation synthesis”,

در شکل ۴ نحوه تشخیص عیب با روش مطرح شده ، برای زمانیکه عیب در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۵ ثانیه رخ داده و به ازای شرایط اولیه غیرصرف‌نشان داده شده است. در لحظه ۵ که عیب اتفاق افتاده بلاfacسله تشخیص صورت گرفته و هیچگونه عدم تشخیصی^۱ وجود ندارد. حدود ۰.۵ ثانیه پس از لحظه ۱۵ که عیب قطع شده مقدار مانده به کمتر از حد آستانه می رسد و عدم وجود عیب در آن لحظه را نشان می دهد.



شکل ۴) تشخیص وقوع عیب سنسوری در در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۵ برای شرایط اولیه غیرصرف.

در شکل ۵ نحوه تشخیص عیب با روش مطرح شده ، برای زمانیکه عیب در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰ ثانیه رخ داده و سپس به مدت ۵ ثانیه قطع و مجددا در لحظه ۱۵ فعال شده است به ازای شرایط اولیه غیرصرف‌نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است روش با دقت و سرعت بسیار خوبی وقوع عیب را تشخیص می دهد، در زمانهای ۵ و ۱۵ ثانیه که عیب اتفاق افتاده بلاfacسله تشخیص صورت گرفته و هیچگونه عدم تشخیص عیبی وجود ندارد. حدود ۰.۵ ثانیه پس از لحظه ۱۰ که عیب قطع شده مقدار مانده به کمتر از حد آستانه می رسد و عدم وجود عیب در آن لحظه را نشان می دهد.



شکل ۵) تشخیص وقوع عیب سنسوری با وجود قطع و وصل عیب برای شرایط اولیه غیرصرف.

۶- نتیجه گیری

در این مقاله روشی جهت تشخیص عیب سنسوری برای کلاسی از سیستم های غیرخطی ارائه شد. ابتدا از طریق ماتریس های انتقال سیستم اصلی به دو زیر سیستم تقسیم شد. به این ترتیب که زیر سیستم اول فقط در برگیرنده عدم قطعیت و زیر سیستم دوم فقط شامل عیب می باشد. سپس عیب سنسوری بصورت عیب عملگری مجازی بیان شد و برای سیستم جدید رویتگر مدل غزشی طراحی شد. شرایط پایداری بررسی شد و بهره

^۱ missed detection

-
- [25] Yan X.G. and Edwards, C. 2007. Nonlinear robust fault reconstruction and estimation using a sliding mode observer. *Automatica*, vol. 43, no.9, pp.1605-1614.
- [26] El-Koujok M, Benammar M, Meskin N, et al. 2014, "Multiple sensor fault diagnosis by evolving data-driven approach". *Information Sciences*, vol. 259, pp. 346-358.
- [27] Zhang K, Jiang B, Yan X.G, Mao Z, 2016, Sliding mode observer based incipient sensor fault detection with application to high-speed railway traction device, *ISA Transaction*, pp. 1-11.
- [28] Tan C.P. and Edwards, C. 2003. Sliding mode observers for robust detection and reconstruction of actuator and sensor faults. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, vol. 13, no. 5, pp.443-463.
- International Journal of Robust and nonlinear control, vol.20, no.16, pp.1785-1801.
- [12] Tan C.P and Edwards C, 2010, "Robust fault reconstruction in uncertain linear systems using multiple sliding mode observers in cascade," *IEEE Transaction on Automatic Control*, vol. 55, no. 4, pp. 855-867.
- [13] Veluvolu K.C, Kim M.Y and Lee D, 2011, "Nonlinear sliding mode high gain observers for fault estimation, *International Journal of Systems Science*", vol.42, no.7, pp. 1065-1074.
- [14] Veluvolu K.C and Soh Y.C, 2011, "Fault reconstruction and state estimation with sliding mode observers for Lipschitz non-linear systems," *IET Control Theory and Applications*, vol. 5, no. 11, pp. 1255- 1263.
- [15] Veluvolu K.C, Kim M.Y and Lee D, 2011, "Nonlinear sliding mode high-gain observers for fault estimation", *International Journal of Systems Science*, vol. 42, no. 7, pp. 1065-1074.
- [16] Yang J, Zhu F, Wang X and Bu X, 2015, "Robust sliding mode observer based sensor fault estimation, actuator fault detection and isolation for uncertain nonlinear systems", *International Journal of Control, Automation and system*, vol. 13, no. 5, pp. 1037-1046.
- [17] Wang X, Tan C.P, Zhou D, 2017, "A novel sliding mode observer for state and fault estimation in systems not satisfying matching and minimum phase conditions", *Automatica*, vol. 79, pp. 290–295.
- [18] Gao Z.W, Ding S.X, 2007, "Actuator fault robust estimation and fault tolerant control for a class of nonlinear descriptor systems", *Automatica*, vol.43, pp. 912-920.
- [19] Meskin N., & Khorasani K. 2009, "Actuator fault detection and isolation for a network of unmanned vehicles", *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol.54, no.4, 835–840.
- [20] Chen W and saif M, 2011, "Actuator fault diagnosis for a class of nonlinear systems and its application to a laboratory 3D crane", *Automatica*, vol. 47, no.7, pp. 1435-1444.
- [21] Yang Q, Ge S.S, Sun Y, 2015, "Adaptive actuator fault tolerant control for uncertain nonlinear systems with multiple actuators", *Automatica*, vol. 60, pp. 92-99.
- [22] Zhang XD. 2011, "Sensor bias fault detection and isolation in a class of nonlinear uncertain systems using adaptive estimation", *IEEE Transaction Automatic Control*, vol. 56, no. 5 pp. 1220-1226.
- [23] Shen QK, Jiang B, Shi P. 2014, "Adaptive fault diagnosis for T-S fuzzy systems with sensor faults and system performance analysis", *IEEE Transaction Fuzzy System*, vol. 22, no. 2, pp. 274-285.
- [24] Du DS, Jiang B, Shi P. 2012, "Sensor fault estimation and compensation for time-delay switched systems". *International Journal of Systems Science*, vol.43, no. 4, pp. 629-640.